(12) 公開特許公報(A)

(19) 日本国特許庁(JP)

(11)特許出願公開番号
 特開2004-279057
 (P2004-279057A)
 (43)公開日 平成16年10月7日(2004.10.7)

(51) Int.C1. ⁷		FΙ			- テーマコード (参考)			
GO1T [*]	1/ 20	GO 1 T	1/20	G	26088			
GO1T ⁴	1/161	GO 1 T	1/20	В				
		GO1T	1/20	D				
		GO1T	1/161	Α				
			守木調寺		講業値の数 0 〇丁 (本 90 百)			
			香宜請水	不雨水	請水項の数 8 OL (主 20 頁)			
(21) 出願番号		特願2003-67094 (P2003-67094)	(71) 出願人	301032942				
(22) 出願日		平成15年3月12日 (2003.3.12)		独立行政法人放射線医学総合研究所				
				千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号				
			(71) 出願人	000001993				
				株式会	社島津製作所			
			/ <u> </u>	京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地				
			(71) 出願人	000236436				
				浜松ホ	トニクス株式会社			
				静岡県浜松市市野町1126番地の1				
			(74)代埋人	100088.	155 E & W # #			
			行われてまし	升埋士	長谷川 方樹 070			
			(74)代埋入	1000899 	978 			
			(74) 段田王	开理工 100009/	鱼口 灰飞 257			
			(14)1(理人 	1000920	00/ 二本体 由朗			
				升埋工	→ 町			

(54) 【発明の名称】 3次元放射線位置検出器

(57)【要約】

【課題】シンチレータアレイの積層数を増やすことが可 能であって放射線吸収位置検出精度が優れた3次元放射 線位置検出器を提供する。

【解決手段】3次元放射線位置検出器1は、シンチレー タユニット10、受光素子20および演算部30を備え る。シンチレータユニット10は、受光素子20の光入 射面上に設けられており、この光入射面に垂直な方向(z軸方向)に4つのシンチレータアレイ11~14が順 に積層されて構成されている。4つのシンチレータアレ イ11~14それぞれは、8×8個のシンチレータアレ イ11~14それぞれは、8×8個のシンチレータセル が2次元配列されて構成されている。シンチレータセル は、放射線の吸収に応じてシンチレーション光を発生さ せるものである。或る層のシンチレータアレイに含まれ るシンチレータセルC_{k1}, m, n と、他の層のシンチ レータアレイに含まれるシンチレータセルC_{k2}, m, n とで、少なくとも1つの同一側面の光学条件が互いに 異なる。 【選択図】 図1



10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】

【請求項1】

前 記 受 光 素 子 の 光 入 射 面 上 に 設 け ら れ 、 放 射 線 の 吸 収 に 応 じ て シ ン チ レ ー シ ョ ン 光 を 発 生 させるシンチレータセルがM行N列(ただし、M,Nは2以上の整数)に2次元配列され てなるシンチレータアレイをK層(ただし、Kは2以上の整数)含み、これらK層のシン チレータアレイが前記受光素子の光入射面に積層されたシンチレータユニットと、 を備え、 前記 Κ 層のシンチレータアレイのうちの第 k 層のシンチレータアレイにおいて第m行第n 列に配置されたシンチレータセルをC_{k.m.}。(ただし、1 k K,1 m M,1 N)と表したときに、 n 前記 K 層のシンチレータアレイのうちの第 k 1 層のシンチレータアレイに含まれるシンチ レータセルC_{k1.m.}mと、第k2層のシンチレータアレイに含まれるシンチレータセ ルC_{k2}, m, cで、少なくとも1つの同一側面の光学条件が互いに異なる(ただし、 ここでは、1 < m < M , 1 < n < N)、 ことを特徴とする3次元放射線位置検出器。 【請求項2】 前 記 シンチレータセルの形状が 直 方体 で あることを 特 徴 とする 請 求 項 1 記 載 の 3 次 元 放 射 線位置検出器。 【請求項3】 前記 Κ 層のシンチレータアレイそれぞれにおいて、隣り合う 2 シンチレータ間の媒質が前 記シンチレーション光に対して反射材および透過材の何れかであり、 前 記 第 k 1 層 の シン チ レ - タ ア レ イ に お い て 前 記 反 射 材 で 囲 わ れ た 領 域 と 、 前 記 第 k 2 層 のシンチレータアレイにおいて前記反射材で囲われた領域とが、積層方向に見たときに互 いに異なる、 ことを特徴とする請求項1記載の3次元放射線位置検出器。 【請求項4】 前記第k1層のシンチレータアレイにおいて、シンチレータセルCk1,p,nとシンチ レータセルC_{k1}, n, との間の媒質、および、シンチレータセルC_{k1}, n, a とシンチレータセル C_{k 1, m, q + 1} との間の媒質が、前記シンチレーション光に対し て反射材であり、他のシンチレータセル間の媒質が、前記シンチレーション光に対して透 過材であり(ただし、 p および q それぞれは公差が 2 の 等差数 列 の 各 整数 値 。 1 p < M , 1 q < N)、 前記第k2層のシンチレータアレイにおいて、シンチレータセルCk2,r,nとシンチ レータセルC_{k2}, r + 1, nとの間の媒質、および、シンチレータセルC_{k2}, m, s とシンチレータセルC_{k2 , m , s+1}との間の媒質が、前記シンチレーション光に対し て反射材であり、他のシンチレータセル間の媒質が、前記シンチレーション光に対して透 過材である(ただし、 r および s それぞれは公差が 2 の等差数列の各整数値。 1 r < M , 1 s < N。「p r」または「q s」)、 ことを特徴とする請求項1記載の3次元放射線位置検出器。 【請求項5】 前 記 シンチ レー タユニット で 発 生 した シンチ レーション 光 が 前 記 受 光 素 子 の 光 入 射 面 に 入 射して前記受光素子から出力された電気信号を入力し、この電気信号に基づいて、前記シ ン チ レ ー タ ユ ニ ッ ト に お け る 放 射 線 吸 収 位 置 を 求 め る 演 算 部 を 更 に 備 え る こ と を 特 徴 と す る請求項1記載の3次元放射線位置検出器。 【請求項6】 前記受光素子が、前記電気信号を出力する複数の出力端子を有し、 前記演算部が、前記受光素子の複数の出力端子それぞれから出力される電気信号を処理し て、前記受光素子へのシンチレーション光の入射位置を求め、そのシンチレーション光の 入射位置に基づいて、前記シンチレータユニットにおける放射線吸収位置を求める、

(2)

光入射面へ入射した光の入射位置および強度に応じた電気信号を出力する受光素子と、

ことを特徴とする請求項5記載の3次元放射線位置検出器。 前記受光素子が、前記電気信号を出力する複数の出力端子を有し、 前記演算部が、前記受光素子の複数の出力端子それぞれから出力される電気信号の値の和 に基づいて、前記シンチレータユニットにおける放射線吸収エネルギを求める、 ことを特徴とする請求項5記載の3次元放射線位置検出器。 前 記 演 算 部 が シンチ レータ セル 毎 に 放 射 線 吸 収 エ ネ ル ギ を 求 め る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 5記載の3次元放射線位置検出器。 【発明の属する技術分野】 本 発 明 は 、 シンチ レー タユニット と 受 光 素 子 とを 含む 3 次 元 放 射 線 位 置 検 出 器 に 関 す る も

(3)

[0002]

のである。

【請求項7】

【請求項8】

[0001]

【発明の詳細な説明】

【従来の技術】

3次元放射線位置検出器は、例えばPET(positron emission to mography)装置において、陽電子放出アイソトープ(RI線源)が投入された被 検体内における電子・陽電子の対消滅に伴って発生し互いに逆方向に飛行する1対の 光子 (エネルギ 5 1 1 k e V) を検出する放射線検出器として用いられる。 P E T 装置は 、放射線検出器により 線光子対を同時計数法により検出し、この同時計数情報を蓄積し てヒストグラムを作成する。そして、PET装置は、この作成されたヒストグラムに基づ いて、測定空間における 線光子対の発生頻度の空間分布を表す画像を再構成する。この PET装置は核医学分野等で重要な役割を果たしており、これを用いて例えば生体機能や 脳の高次機能の研究を行うことができる。

[0003]

このようなPET装置の放射線検出器として好適に用いられ得る3次元放射線位置検出器 は、シンチレータユニットおよび受光素子を含む(例えば特許文献1や非特許文献1を参 照)。このうち、受光素子は、光入射面へ入射した光の入射位置および強度に応じた電気 信号を出力する。また、シンチレータユニットは、受光素子の光入射面上に設けられ、放 射 線 の 吸 収 に 応 じ て シ ン チ レ ー シ ョ ン 光 を 発 生 さ せ る シ ン チ レ ー タ セ ル が 2 次 元 配 列 さ れ てなるシンチレータアレイをK層(ただし、Kは2以上の整数)含み、これらK層のシン チレータアレイが受光素子の光入射面に垂直な方向に積層されたものである。

[0004]

特 に 、 特 許 文 献 1 に 開 示 さ れ た 3 次 元 放 射 線 位 置 検 出 器 で は 、 K 層 の シ ン チ レ ー タ ア レ イ は、シンチレータセル配置ピッチの1/Kずつ行方向または列方向にずれて積層されてい る。また、非特許文献1に開示された3次元放射線位置検出器では、第1層および第3層 のシンチレータアレイと、第2層および第4層のシンチレータアレイとでは、異なる蛍光 減衰時定数のシンチレータセルが用いられている。

[0005]

このような 3 次元放射線位置検出器は、シンチレータユニットにおける放射線吸収位置を 、受光素子の光入射面に平行な2次元平面上の位置として求めることができるだけでなく 、この光入射面からの距離としても求めることができる。すなわち、複数のシンチレータ セルが 3次元配列されてなるシンチレータユニットにおいて何れのシンチレータセルでシ ンチレーション光が発生したかを、受光素子の光入射面に到達したシンチレーション光の 重心位置に基づいて判別することができる。

[0006]

【特許文献1】

特開平1-229995号公報

【非特許文献1】

30

40

20

N. Inadama, et al., "A Depth of Interact ive Detector for PET with GSO Crystals D oped with Different Amounts of Ce", IEEE Transaction of Nuclear Science, Vol.49, No.3, pp.629-633 (2002)

(4)

【 0 0 0 7 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記の特許文献1に開示された3次元放射線位置検出器では、放射線の吸 収に応じてシンチレーション光を発生させたシンチレータセルの位置が受光素子の光入射 面から遠いほど、受光素子の光入射面に到達するシンチレーション光の強度分布の幅が広 い。受光素子の光入射面において、シンチレーション光の強度分布の幅が広いと、重心位 置に基づいて対応シンチレータセルを判定することが困難となる。それ故、シンチレータ アレイの積層数を多くするにも限界があり、また、放射線吸収位置検出精度の点でも限界 がある。

[0008]

また、上記の非特許文献1に開示された3次元放射線位置検出器では、積層方向に見たと きに各シンチレータアレイの同一位置にあるシンチレータセルそれぞれで発生したシンチ レーション光は、受光素子の光入射面において重心位置が互いに近いものとなる。それ故 、この場合にも、シンチレータアレイの積層数を多くするにも限界があり、また、放射線 吸収位置検出精度の点でも限界がある。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$

本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、シンチレータアレイの積層数 を増やすことが可能であって放射線吸収位置検出精度が優れた3次元放射線位置検出器を 提供することを目的とする。

【 0 0 1 0 】

【課題を解決するための手段】

本発明に係る3次元放射線位置検出器は、(1) 光入射面へ入射した光の入射位置および強度に応じた電気信号を出力する受光素子と、(2) 受光素子の光入射面上に設けられ、放射線の吸収に応じてシンチレーション光を発生させるシンチレータセルがM行N列(ただし、M,Nは2以上の整数)に2次元配列されてなるシンチレータアレイをK層(ただし、Kは2以上の整数)含み、これらK層のシンチレータアレイが受光素子の光入射面に積層されたシンチレータユニットと、を備える。そして、K層のシンチレータアレイにおいて第m行第n列に配置されたシンチレータアレイのうちの第k層のシンチレータアレイにおいて第m行第n列に配置されたシンチレータセルCk,mm,n(ただし、1 k K,1 m M,1 n N)と表したときに、K 層のシンチレータアレイのうちの第k1層のシンチレータアレイに含まれるシンチレータセルCk,1 m,n と、第k2層のシンチレータアレイに含まれるシンチレータセルCk 1 m, n と、第k2層のシンチレータアレイに含まれるシンチレータセルCk 1 m, n とて、少なくとも1つの同一側面の光学条件が互いに異なる(ただし、ここでは、1 < m < M, 1 < n < N) ことを特徴とする。

[0011]

このように構成される 3 次元放射線位置検出器では、シンチレータユニットに放射線(例 40 えば 線)が入射して、シンチレータユニット内の何れかのシンチレータセルで該放射線 が吸収されると、その放射線を吸収したシンチレータセルにおいて、放射線吸収エネルギ に応じた強度のシンチレーション光が発生する。そのシンチレーション光は、その発生点 からは全方位に向かって進むものの、反射材により反射されることでガイドされ、やがて 受光素子の光入射面に入射する。受光素子の光入射面へのシンチレーション光入射の重心 位置は、シンチレーション光発生位置(すなわち放射線吸収位置)に対応したものである

[0012]

そして、第 k 1 層のシンチレータアレイに含まれるシンチレータセル C _{k 1} , _m , _n と、 第 k 2 層のシンチレータアレイに含まれるシンチレータセル C _{k 2} , _m , _n とで、少なく 50

とも1つの同一側面の光学条件(例えば、反射率、透過率、粗度、など)が互いに異なる ことにより、放射線の吸収に応じてシンチレーション光を発生させたシンチレータセルの 位置が受光素子の光入射面から遠くても、受光素子の光入射面に到達するシンチレーショ ン光の強度分布の幅は狭い。また、積層方向に見たときに各シンチレータアレイの同一位 置にあるシンチレータセルそれぞれで発生したシンチレーション光は、受光素子の光入射 面において重心位置が充分に離れたものとなる。それ故、シンチレータアレイの積層数を 増やすことが可能であり、また、放射線吸収位置検出精度が優れたものとなる。

【0013】

本発明に係る3次元放射線位置検出器は、シンチレータセルの形状が直方体であるのが好 適である。この場合には、シンチレータユニットにおいて多数のシンチレータアレイを3 10 次元配置する際に効率的である。

【0014】

本発明に係る3次元放射線位置検出器は、K層のシンチレータアレイそれぞれにおいて、 隣 り 合 う 2 シンチレータ間の 媒質 が シンチレーション 光 に 対 し て 反 射 材 お よ び 透 過 材 の 何 れかであり、第k1層のシンチレータアレイにおいて反射材で囲われた領域と、第k2層 のシンチレータアレイにおいて反射材で囲われた領域とが、積層方向に見たときに互いに 異なるのが好適である。また、本発明に係る3次元放射線位置検出器は、(1) 第k1 層のシンチレータアレイにおいて、シンチレータセルC_{k 1} , p , n とシンチレータセル C_{k1,p+1}, cの間の媒質、および、シンチレータセルC_{k1,m}, cとシンチレ ータセルC_{k 1 , m , g + 1} との間の媒質が、シンチレーション光に対して反射材であり 、他のシンチレータセル間の媒質が、シンチレーション光に対して透過材であり、(2) 第k2層のシンチレータアレイにおいて、シンチレータセルCk2,r,nとシンチレ ータセル C_{k2}, r + 1 , n との間の媒質、および、シンチレータセル C_{k2}, m , s と シンチレータセル C_{k2,m,s+1} との間の媒質が、シンチレーション光に対して反射 材であり、他のシンチレータセル間の媒質が、シンチレーション光に対して透過材であっ て、(3) r および s それぞれは公差が 2 の 等差数 列の各整数 値 であり、 1 p < M , q < N , 1 r < M , 1 s < N , 「p r」または「q s」であるのが好適であ 1 る。これらの場合には、受光素子の光入射面へのシンチレーション光入射の重心位置は、 シンチレーション光発生位置(すなわち放射線吸収位置)に対応したものであり、しかも 、 受 光 素 子 の 光 入 射 面 に お け る シ ン チ レ ー シ ョ ン 光 の 強 度 分 布 の 幅 は 充 分 に 狭 く 、 各 々 の 光入射の重心位置は充分に弁別が可能である。

【0015】

本発明に係る3次元放射線位置検出器は、シンチレータユニットで発生したシンチレーション光が受光素子の光入射面に入射して受光素子から出力された電気信号を入力し、この電気信号に基づいて、シンチレータユニットにおける放射線吸収位置を求める演算部を更に備えるのが好適である。本発明に係る3次元放射線位置検出器は、受光素子が、電気信号を出力する複数の出力端子を有し、演算部が、受光素子の複数の出力端子それぞれから出力される電気信号を処理して、受光素子へのシンチレーション光の入射位置を求め、そのシンチレーション光の入射位置に基づいて、シンチレータユニットにおける放射線吸収位置を求めるのが好適である。本発明に係る3次元放射線位置検出器は、演算部がシンチレータセル毎に放射線吸収エネルギを求めるのが好適である。

[0016]

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明にお いて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、各図において説 明の便宜の為に × y z 直交座標系が示されている。

【0017】

20

30

先ず、本発明に係る3次元放射線位置検出器の第1実施形態について説明する。図1は、 第1実施形態に係る3次元放射線位置検出器1の構成図である。この図に示される3次元 放射線位置検出器1は、シンチレータユニット10、受光素子20および演算部30を備 える。図1では、シンチレータユニット10および受光素子20については斜視図で示さ れ、演算部30についてはブロック図で示されている。

受光素子20は、光入射面へ入射した光の入射位置および強度に応じた電気信号を出力す るものである。×yz直交座標系の×y平面は、光入射面に平行に設定されている。受光 素子20は、例えば、位置検出型の光電子増倍管である。また、位置検出型光電子増倍管 としてマルチアノード型のものが好適に用いられる。マルチアノード型の光電子増倍管は 、2次元配列された複数のアノードと、各アノードに対応したアノード端子とを備え、各 アノード端子と4つの出力端子211~214とが抵抗器を介して接続されていて、各ア ノードからの電気信号を最終的に4つの出力端子211~214から出力する(特開20 00-180551号公報(特に図5)を参照)。これら4つの出力端子211~214 から出力される電気信号の値の比は、光入射面への光の入射位置に応じたものとなり、ま た、これら4つの出力端子211~214から出力される電気信号の値の和は、光強度に 応じたものとなる。

【0019】

シンチレータユニット10は、受光素子20の光入射面上に設けられており、この光入射 面に垂直な方向(z 軸方向)に4つのシンチレータアレイ11~14が順に積層されて構 成されている。なお、シンチレータユニット10は、受光素子20の光入射面上に直接に 設けられてもよいし、或いは、光学カップリング材(屈折率整合材)、ファイバアレイお よび空気層など介して設けられてもよい。また、4つのシンチレータアレイ11~14そ れぞれは、複数(本実施形態では8×8個)のシンチレータセルが2次元配列されて構成 されている。このシンチレータセルの配列の方向は×軸方向および y 軸方向である。 【0020】

シンチレータセルは、放射線の吸収に応じてシンチレーション光を発生させるものであり、例えば、CeがドープされたGd₂SiO₅(GSO)やBi₄Ge₃O₁₂(BGO)が用いられる。シンチレータセルの形状は直方体である。また、4つのシンチレータアレイ11~14のうちの何れか2つのシンチレータアレイの間でシンチレータセルの組成が互いに異なり蛍光減衰時定数が互いに異なっていてもよいが、全シンチレータセルの組成が同一であってもよい。

ここで、 4 つのシンチレータアレイ 1 1 ~ 1 4 のうちの受光素子 2 0 側から数えて第 k 層目のシンチレータアレイ 1 k において第 m 行第 n 列に配置されたシンチレータセルを C _k , m, n と表す。図 1 では、 4 層 × 8 行 × 8 列に 3 次元配列された 2 5 6 個のシンチレー タセルのうちの幾つかについてのみ符号 C _k, m, n が付されている。

【0022】

演算部30は、比演算回路31、和演算回路32および信号処理回路33を含み、受光素 子20の4つの出力端子21₁~21₄それぞれから出力された電気信号を入力して、この電気信号に基づいて所定の演算を行う。ここで、出力端子21₁(図1では不図示)は シンチレータセルC_{1,1},1,0側の角にあり、出力端子21₂はシンチレータセルC₁ ,8,1の側の角にあり、出力端子21₃はシンチレータセルC_{1,1},8の側の角にあ り、また、出力端子21₄はシンチレータセルC_{1,8},8の側の角にあるとする。 【0023】

比演算回路31は、受光素子20の4つの出力端子21₁~21₄それぞれから出力され た電気信号の値の比に基づいて、受光素子20の光入射面への光の入射位置を求める。具 体的には、出力端子21₁から出力される電気信号の値をI₁とし、出力端子21₂から 出力される電気信号の値をI₂とし、出力端子21₃から出力される電気信号の値をI₃ とし、出力端子21₄から出力される電気信号の値をI₄としたときに、比演算回路31 10

は、受光素子20の光入射面への光の入射位置(×, γ)を、 $X = (I_1 + I_3) / I_{a 1 1}$... (1 a) $y = (I_1 + I_2) / I_{a | 1}$... (1b) $I_{a_1} = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 \dots (1 c)$ なる式に基づいて求める。また、和演算回路32は、受光素子20の4つの出力端子21 1 ~ 2 1 』 それぞれから出力された電気信号の値の和 I 』 」 に基づいて、受光素子 2 0 の光入射面へ入射した光の強度を求める。 [0024]信号処理回路33は、比演算回路31および和演算回路32それぞれにおける上記の結果 を 入 力 し て 、 シ ン チ レ ー タ ユ ニ ッ ト 1 0 に お け る 放 射 線 吸 収 位 置 お よ び 放 射 線 吸 収 エ ネ ル 10 ギを求め、その求めた結果を出力する。また、演算部30は、シンチレータセル毎に放射 線吸収エネルギを求めるのが好適である。 [0025]図 2 ~ 図 7 それぞれは、第 1 実施形態に係る 3 次元放射線位置検出器 1 に含まれるシンチ レータユニット10の断面図である。図2は、第1行(m=1)のシンチレータユニット 10のyz断面図である。図3は、第1列(n=1)のシンチレータユニット10の×z 断面図である。図4は、第1層(k=1)のシンチレータアレイ11のxy断面図である 。図 5 は、第 2 層(k = 2)のシンチレータアレイ 1 2 の x y 断面図である。図 6 は、第 3 層 (k = 3) のシンチレータアレイ 1 3 の x y 断面図である。また、図 7 は、第 4 層 (k = 4)のシンチレータアレイ14のxy断面図である。なお、これらの図において、幾 20 つかのシンチレータセルについてのみ符号 C_k, m, nが付されているが、符号が付され ていないシンチレータセルについては符号 C_k, m, nの添え字 k, m, nの何れかが順 次1増して付される。 [0026]第 1 層のシンチレータアレイ 1 1 では、シンチレータセル C_{1 2} n とシンチレータセ ルC₁, 3, nとの間の媒質、シンチレータセルC₁, 4, nとシンチレータセルC₁, ₅ , n との間の媒質、シンチレータセルC₁ , ₆ , n とシンチレータセルC₁ , ₇ , n と の間の媒質、シンチレータセルC1, m, 2とシンチレータセルC1, m, 3との間の媒 質、シンチレータセルC_{1.m.4}とシンチレータセルC_{1.m.5}との間の媒質、およ び、シンチレータセルC_{1.m.6}とシンチレータセルC_{1.m.7}との間の媒質は、シ ンチレーション光に対して高反射率である反射材Rである。ただし、mおよびnそれぞれ は1以上8以下の各整数である。他のシンチレーション間の媒質は、シンチレーション光 に対して高透過率である透過材工である。 第2層のシンチレータアレイ12では、シンチレータセルC₂₁₁のとシンチレータセ ル C 2 , 2 , n との間の媒質、シンチレータセル C 2 , 3 , n とシンチレータセル C 2 , 4 , n との間の媒質、シンチレータセル C 2 , 5 , n とシンチレータセル C 2 , 6 , n と の間の媒質、シンチレータセルC₂, ₇, nとシンチレータセルC₂, ₈, nとの間の媒 質、シンチレータセルC₂,m,2とシンチレータセルC₂,m,3との間の媒質、シン チレータセルC₂, m, 4 とシンチレータセルC₂, m, 5 との間の媒質、および、シン 40 チレータセルC₂, m, 6とシンチレータセルC₂, m, 7との間の媒質は、シンチレー ション光に対して高反射率である反射材Rである。他のシンチレーション間の媒質は、シ ンチレーション光に対して高透過率である透過材工である。 第 3 層のシンチレータアレイ 1 3 では、シンチレータセル C_{3,2,n} とシンチレータセ ₅ , n との間の媒質、シンチレータセル C₃ , ₆ , n とシンチレータセル C₃ , ₇ , n と の間の媒質、シンチレータセルC3,m,1とシンチレータセルC3,m,2との間の媒

(7)

質、シンチレータセルC_{3,m,4}とシンチレータセルC_{3,m,4}との間の媒質、シン チレータセルC_{3, m, 5}とシンチレータセルC_{3, m, 6}との間の媒質、および、シン 50

チレータセルC₃, m, 7 とシンチレータセルC₃, m, 8 との間の媒質は、シンチレー ション光に対して高反射率である反射材 R である。他のシンチレーション間の媒質は、シ ンチレーション光に対して高透過率である透過材 T である。 【0029】

(8)

第4層のシンチレータアレイ14では、シンチレータセルC₄, 1, nとシンチレータセ ルC₄, 2, nとの間の媒質、シンチレータセルC₄, 3, nとシンチレータセルC₄, 4, nとの間の媒質、シンチレータセルC₄, 5, nとシンチレータセルC₄, 6, nと の間の媒質、シンチレータセルC₄, 7, nとシンチレータセルC₄, 8, nとの間の媒 質、シンチレータセルC₄, m, 1とシンチレータセルC₄, m, 2との間の媒質、シン チレータセルC₄, m, 4とシンチレータセルC₄, m, 4との間の媒質、シン チレータセルC₄, m, 5とシンチレータセルC₄, m, 6との間の媒質、および、シンチレータ セルC₄, m, 7とシンチレータセルC₄, m, 8との間の媒質は、シンチレータ セルC₄, m, 7とシンチレータセルC₄, m, 8との間の媒質は、シンチレータ セルC₄, m, 7とシンチレータセルC₄, m, 8との間の媒質は、シンチレーション光 に対して高反射率である反射材 R である。他のシンチレーション間の媒質は、シンチレー

また、シンチレータユニット10の全体の外面のうち、受光素子10の光入射面と接する 面は、シンチレーション光に対して高透過率である透過材工で覆われており、他の面は、 シンチレーション光に対して高反射率である反射材Rで覆われている。なお、図1では、 シンチレータユニット10の外面にある反射材Rは図示されていない。また、第1層シン チレータアレイ11と第2層シンチレータアレイ12との間の媒質、第2層シンチレータ アレイ12と第3層シンチレータアレイ13との間の媒質、および、第3層シンチレータ アレイ13と第4層シンチレータアレイ14との間の媒質は、シンチレーション光に対し て高透過率である透過材工である、

反射材 R は、透過材 T と比較して、シンチレーション光を高い反射率で反射させるもので ある。また、透過材 T は、反射材 R と比較して、シンチレーション光を高い透過率で透過 させるものである。反射材 R は、例えば B a S O 4 からなるものである。また、透過材 T は、例えば、シンチレータセルと同組成の材料からなるものであり、或いは、シリコング リス等の光学結合材からなるものであり、或いは、空気等の気体からなるものである。図 2 ~ 図 7 それぞれでは、反射材 R については共通のハッチングで示されており、透過材 T についても共通のハッチング(反射材 R とは異なるハッチング)で示されている。 【0031】

以上のように、シンチレータユニット10では、第k1層のシンチレータアレイに含まれ るシンチレータセルC_{k1, m}, _nと、他の第k2層のシンチレータアレイに含まれるシ ンチレータセルC_{k2, m}, _nとで、少なくとも1つの同一側面の光学条件が互いに異な る(ただし、ここでは、1<m<8,1<n<8)。 【0032】

特に第1実施形態では、4つのシンチレータアレイ11~14のうちの第k1層のシンチレータアレイにおいて、シンチレータセルC_{k1}, p, nとシンチレータセルC_{k1}, p, + 1, n との間の媒質、および、シンチレータセルC_{k1}, m, q とシンチレータセルC k 1, m, q + 1 との間の媒質が、シンチレーション光に対して反射材Rであり、他のシンチレータセル間の媒質が、シンチレーション光に対して透過材Tである。また、他の第 k 2 層のシンチレータアレイにおいて、シンチレータセルC_{k2}, r, n とシンチレータ セルC_{k2}, r + 1, n との間の媒質、および、シンチレータセルC_{k2}, m, s とシン チレータセルC_{k2}, r, + 1, n との間の媒質が、シンチレータセルC_{k2}, m, s とシン チレータセルC_{k2}, r, + 1, n との間の媒質が、シンチレータセルC_{k2}, m, s とシン チレータセルC_{k2}, r, + 1, n との間の媒質が、シンチレータセルC_{k2}, m, s + 1 との間の媒質が、シンチレーション光に対して反射材R であり、他のシンチレータセル間の媒質が、シンチレーション光に対して透過材Tである 。そして、p, q, r およびs それぞれは公差が2の等差数列の各整数値であり、「p r」または「q s」である。

第 1 実施形態に係る 3 次元放射線位置検出器 1 は以下のように動作する。この 3 次元放射 線位置検出器 1 のシンチレータユニット 1 0 に放射線(例えば 線)が入射して、シンチ 50

10

20



レータユニット10内の何れかのシンチレータセルで該放射線が吸収されると、その放射線を吸収したシンチレータセルにおいて、放射線吸収エネルギに応じた強度のシンチレーション光が発生する。そのシンチレーション光は、その発生点からは全方位に向かって進むものの、反射材Rにより反射されることでガイドされ、やがて受光素子20の光入射面に入射する。

【0034】

受光素子20の光入射面へのシンチレーション光入射の重心位置は、シンチレーション光 発生位置(すなわち放射線吸収位置)の×座標値およびy座標値(すなわち、m値および n値)に対応したものである。しかも、反射材Rおよび透過材Tが適切に配置されている ことにより、放射線の吸収に応じてシンチレーション光を発生させたシンチレータセルの 位置が受光素子20の光入射面から遠くても、受光素子20の光入射面に到達するシンチ レーション光の強度分布の幅は狭い。また、積層方向に見たときに各シンチレータアレイ の同一位置にあるシンチレータセルそれぞれで発生したシンチレーション光は、受光素子 20の光入射面において重心位置が充分に離れたものとなる。それ故、シンチレータアレ イの積層数を増やすことが可能であり、また、放射線吸収位置検出精度が優れたものとな る。

[0035]

図8は、第1実施形態に係る3次元放射線位置検出器1の受光素子20の光入射面へのシ ンチレーション光入射の重心位置の説明図である。図中で、 印は、第1層のシンチレー の光入射面への入射の重心位置 Р 1 , m , n を示す。 印は、第 2 層のシンチレータアレ イ12に含まれる各シンチレータセルC2,m,nで発生したシンチレーション光の光入 射面への入射の重心位置P₂, m , nを示す。 印は、第3層のシンチレータアレイ13 に含まれる各シンチレータセル C_{3,m}, で発生したシンチレーション光の光入射面へ の入射の重心位置 Р_{3, m, n}を示す。また、 印は、第4層のシンチレータアレイ14 に含まれる各シンチレータセルC4, m, n で発生したシンチレーション光の光入射面へ の入射の重心位置 Р₄, _m, _nを示す。なお、この図において、幾つかの重心位置につい てのみ符号P_{k ・ m ・} が付されているが、符号が付されていない重心位置については符 号 P_{k m} の添え字 k , m , n の何れかが順次 1 増して付される。この図に示される ように、シンチレータユニット10において3次元配列された多数のシンチレータセルそ れ ぞ れ で 発 生 し た シ ン チ レ ー シ ョ ン 光 は 、 受 光 素 子 2 0 の 光 入 射 面 上 の 互 い に 異 な る 重 心 位置に入射し、しかも、各々の光入射の重心位置は充分に弁別が可能である。 [0036]

図 9 は、第 1 実施形態に係る 3 次元放射線位置検出器 1 の受光素子 2 0 の光入射面へ入射 する光の波高分布を示す図である。ここでは、シンチレータユニット 1 0 に入射する放射 線のエネルギが一定であるとして、シンチレータセル C₁, 1, 1 ~ C₁, 1, 4 、 C₂ , 1, 1 ~ C₂, 1, 4 、 C₃, 1, 1 ~ C₃, 1, 4 および C₄, 1, 1 ~ C₄, 1, 4 それぞれにおいて放射線が吸収されたときに、受光素子 2 0 の光入射面へ入射する光の 波高分布が示されている。

[0037]

したがって、比演算回路31により、受光素子20の4つの出力端子21₁~21₄それ ぞれから出力された電気信号の値から、上記(1a)~(1c)式に基づいて受光素子2 0の光入射面へのシンチレーション光の入射位置を求め、予め作成され比演算回路31内 のメモリに格納されている受光素子20の光入射面の光入射位置とシンチレータユニット 10での放射線吸収位置との対応を示すテーブル(例えば図8)を参照して、シンチレー タユニット10において3次元配列された複数のシンチレータセルのうちの何れで放射線 が吸収されたかを弁別することができる。また、和演算回路32により、受光素子20の 4つの出力端子21₁~21₄それぞれから出力された電気信号の値の和に基づいて、放 射線吸収エネルギを求めることができる。

【0038】

20

次に、本発明に係る3次元放射線位置検出器の実施例について説明する。実施例の3次元 放射線位置検出器では、シンチレータユニットは、シンチレータアレイが4層に積層され 、各シンチレータアレイは、6×6個のシンチレータセルが2次元配列されたものである 。図10は、実施例の3次元放射線位置検出器の受光素子の光入射面へのシンチレーショ ン光入射の強度分布を示す図である。図11は、実施例の3次元放射線位置検出器の受光 素子の光入射面へ入射する光の波高分布を示す図である。ここでは、シンチレータユニッ トに入射する放射線のエネルギが一定であるとし、また、放射線が一様に入射するとした 。図11では、シンチレータセルC1,3,3 ~ C2,3,3 およびC1,5,4 ~ C4 ,5,4 それぞれにおいて放射線が吸収されたときに、受光素子20の光入射面へ入射す る光の波高分布が示されている。

(10)

【0039】

図12は、比較例の3次元放射線位置検出器の受光素子の光入射面へのシンチレーション 光入射の強度分布を示す図である。この比較例の3次元放射線位置検出器は、従来の技術 の欄で挙げた非特許文献1に開示された構成のものである。

[0040]

実施例(図10)と比較例(図12)とを比較してわかるように、第1実施形態に係る3 次元放射線位置検出器1では、放射線の吸収に応じてシンチレーション光を発生させたシ ンチレータセルの位置が受光素子の光入射面から遠くても、受光素子の光入射面に到達す るシンチレーション光の強度分布の幅は狭い。また、積層方向に見たときに各シンチレー タアレイの同一位置にあるシンチレータセルそれぞれで発生したシンチレーション光は、 受光素子の光入射面において重心位置が充分に離れたものとなる。それ故、シンチレータ アレイの積層数を増やすことが可能であり、また、放射線吸収位置検出精度が優れたもの となる。したがって、この3次元放射線位置検出器1をPET装置に使用することにより 、高感度・高解像度・高速に被検体を測定することができる。

【0041】

次に、本発明に係る3次元放射線位置検出器の第2実施形態について説明する。第2実施 形態に係る3次元放射線位置検出器は、図1に示されたものと略同様の構成であるが、シ ンチレータユニット10の構成が相違している。すなわち、第2実施形態におけるシンチ レータユニット10は6層のシンチレータアレイ11~16を含み、これらシンチレータ アレイ11~16それぞれはシンチレータセルが12行12列に2次元配列されている(K=6,M=N=12)。また、シンチレータセル間の反射材Rおよび透過材Tの配置の 態様が第1実施形態と異なる。

[0042]

図13~図20それぞれは、第2実施形態に係る3次元放射線位置検出器に含まれるシン チレータユニット10の断面図である。図13は、第1行(m=1)のシンチレータユニ ット10のyz断面図である。図14は、第1列(n=1)のシンチレータユニット10 の×z断面図である。図15は、第1層(k=1)のシンチレータアレイ110の×y断面 図である。図16は、第2層(k=2)のシンチレータアレイ12の×y断面図である。 図17は、第3層(k=3)のシンチレータアレイ13の×y断面図である。図18は、 第4層(k=4)のシンチレータアレイ140×y断面図である。図19は、第5層(k =5)のシンチレータアレイ15の×y断面図である。また、図20は、第6層(k=6)のシンチレータアレイ150×y断面図である。なお、これらの図において、幾つかの シンチレータセルについてのみ符号C_k,m,n,の添え字k,m,nの何れかが順次1増 して付される。

【0043】

第 1 層のシンチレータアレイ 1 1 では、シンチレータセル C₁,_p, n とシンチレータセ ル C₁,_{p+1}, n との間の媒質(pは 2 , 4 , 6 , 8 および 1 0 の各整数)、および、 シンチレータセル C₁,_m,_q とシンチレータセル C₁,_m,_{q+1} との間の媒質(qは 2 , 4 , 6 , 8 および 1 0 の各整数)は、シンチレーション光に対して高反射率である反 10

20



射材Rである。ただし、mおよびnそれぞれは1以上12以下の各整数である。他のシン チレーション間の媒質は、シンチレーション光に対して高透過率である透過材工である。 [0044]第 2 層のシンチレータアレイ 1 2 では、シンチレータセル C _{2 , p , n} とシンチレータセ ルC₂,_{p+1}, nとの間の媒質(pは1~11の各整数)、および、シンチレータセル C ₂ _ m _ 。とシンチレータセル C ₂ _ m _ 。 + 1 との間の媒質(q は 2 , 4 , 6 , 8 お よび10の各整数)は、シンチレーション光に対して高反射率である反射材Rである。他 のシンチレーション間の媒質は、シンチレーション光に対して高透過率である透過材工で ある。 [0045]第3層のシンチレータアレイ13では、シンチレータセルC3,0,0とシンチレータセ ル C_{3 , p + 1} , n との間の媒質(pは1 , 3 , 5 , 7 , 9 および1 1 の各整数)、およ び、シンチレータセルC₃, m, aとシンチレータセルC₃, m, a + 1 との間の媒質(qは2,4,6,8および10の各整数)は、シンチレーション光に対して高反射率であ る反射材Rである。他のシンチレーション間の媒質は、シンチレーション光に対して高透 過率である透過材Tである。 [0046]第 4 層のシンチレータアレイ 1 4 では、シンチレータセル C 4 , p , n とシンチレータセ ル C₄ , _{p + 1} , _n との間の媒質(p は 2 , 4 , 6 , 8 および 1 0 の各整数)、および、 シンチレータセル C₄, m, g とシンチレータセル C₄, m, g + 1 との間の媒質(q は 1~11の各整数)は、シンチレーション光に対して高反射率である反射材 R である。他 のシンチレーション間の媒質は、シンチレーション光に対して高透過率である透過材工で ある。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 7 \end{bmatrix}$ 第 5 層のシンチレータアレイ1 5 では、シンチレータセル C _{5 , p , n} とシンチレータセ ルC₅, _{p+1}, との間の媒質(pは2,4,6,8および10の各整数)、および、 1 , 3 , 5 , 7 , 9 および 1 1 の各整数)は、シンチレーション光に対して高反射率であ る反射材Rである。他のシンチレーション間の媒質は、シンチレーション光に対して高透 過率である透過材Tである。 [0048]第 6 層のシンチレータアレイ1 6 では、シンチレータセル C _{6 , p} , n とシンチレータセ ルC₆, _{p+1}, _n との間の媒質(pは1,3,5,7,9および11の各整数)、およ び、シンチレータセルC_{6 , m}, _q とシンチレータセルC_{6 , m}, _{q + 1} との間の媒質(qは1,3,5,7,9および11の各整数)は、シンチレーション光に対して高反射率 である反射材Rである。他のシンチレーション間の媒質は、シンチレーション光に対して 高透過率である透過材工である。 [0049]また、シンチレータユニット10の全体の外面のうち、受光素子10の光入射面と接する 面は、シンチレーション光に対して高透過率である透過材工で覆われており、他の面は、 シンチレーション光に対して高反射率である反射材Rで覆われている。また、第1層シン

10

20

30

40

50

ンノテレーショノエに刈して高反射率である反射材 R で復われている。また、第1 層シン チレータアレイ11と第2 層シンチレータアレイ12との間の媒質、第2 層シンチレータ アレイ12と第3 層シンチレータアレイ13との間の媒質、第3 層シンチレータアレイ1 3と第4 層シンチレータアレイ14との間の媒質、第4 層シンチレータアレイ14と第5 層シンチレータアレイ15との間の媒質、および、第5 層シンチレータアレイ15と第6 層シンチレータアレイ16との間の媒質は、シンチレーション光に対して高透過率である 透過材 T である、

反射材 R は、透過材 T と比較して、シンチレーション光を高い反射率で反射させるもので ある。また、透過材 T は、反射材 R と比較して、シンチレーション光を高い透過率で透過 させるものである。図13~図20それぞれでは、反射材 R については共通のハッチング

(11)

(12)

で示されており、透過材 T についても共通のハッチング(反射材 R とは異なるハッチング)で示されている。

【 0 0 5 0 】

以上のように、シンチレータユニット10では、第k1層のシンチレータアレイに含まれ るシンチレータセルC_{k1,m,n}と、他の第k2層のシンチレータアレイに含まれるシ ンチレータセルC_{k2,m,n}とで、少なくとも1つの同一側面の光学条件が互いに異な る(ただし、ここでは、1<m<12,1<n<12)。特に第2実施形態では、6層の シンチレータアレイ11~16それぞれにおいて、隣り合う2シンチレータ間の媒質がシ ンチレーション光に対して反射材Rおよび透過材Tの何れかであり、第k1層のシンチレ ータアレイにおいて反射材Rで囲われた領域と、他の第k2層のシンチレータアレイにお いて反射材Rで囲われた領域とが、積層方向に見たときに互いに異なる。 【0051】

図 2 1 は、 第 2 実 施 形 態 に 係 る 3 次 元 放 射 線 位 置 検 出 器 の 受 光 素 子 2 0 の 光 入 射 面 へ の シ ンチレーション光入射の重心位置の説明図である。図中で、符号「1」は、第1層のシン チレータアレイ11に含まれる各シンチレータセルC_{1 , m , n} で発生したシンチレーシ ョン光の光入射面への入射の重心位置を示す。符号「2」は、第2層のシンチレータアレ イ12に含まれる各シンチレータセルC2,m,nで発生したシンチレーション光の光入 射面への入射の重心位置を示す。符号「3」は、第3層のシンチレータアレイ13に含ま の重心位置を示す。符号「4」は、第4層のシンチレータアレイ14に含まれる各シンチ 示す。符号「5」は、第5層のシンチレータアレイ15に含まれる各シンチレータセルC 5 , m , n で発生したシンチレーション光の光入射面への入射の重心位置を示す。また、 符号「6」は、第6層のシンチレータアレイ16に含まれる各シンチレータセルC。」 ____ で発生したシンチレーション光の光入射面への入射の重心位置を示す。この図に示さ れるように、シンチレータユニット10において3次元配列された多数のシンチレータセ ルそれぞれで発生したシンチレーション光は、受光素子20の光入射面上の互いに異なる 重心位置に入射し、しかも、各々の光入射の重心位置は充分に弁別が可能である。 [0052]

本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、 30 シンチレータユニットにおけるシンチレータアレイの層数は、上記実施形態では4または 6 であったが、2,3または5 であってもよく、また、7 以上であってもよい。また、シ ンチレータアレイによってシンチレータセルの蛍光減衰時定数が互いに異なるものであっ てもよく、この場合には、シンチレータユニットにおけるシンチレータアレイの層数を更 に増やすことが可能である。

【 0 0 5 3 】

【発明の効果】

以上、詳細に説明したとおり、本発明に係る3次元放射線位置検出器では、受光素子の光入射面へのシンチレーション光入射の重心位置は、シンチレーション光発生位置(すなわち放射線吸収位置)に対応したものであり、しかも、各シンチレータセルの光学条件が適40切に設定されていることにより、放射線の吸収に応じてシンチレーション光を発生させたシンチレータセルの位置が受光素子の光入射面から遠くても、受光素子の光入射面に到達するシンチレーション光の強度分布の幅は狭い。また、積層方向に見たときに各シンチレータアレイの同一位置にあるシンチレータセルそれぞれで発生したシンチレーション光は、受光素子の光入射面において重心位置が充分に離れたものとなる。それ故、シンチレータアレイの積層数を増やすことが可能であり、また、放射線吸収位置検出精度が優れたものとなる。

【図面の簡単な説明】 【図1】第1実施形態に係る3次元放射線位置検出器1の構成図である。 【図2】第1実施形態に係る3次元放射線位置検出器1に含まれるシンチレータユニット 50

10

10のうち第1行のシンチレータユニット10のyz断面図である。 【図3】第1 実施形態に係る3次元放射線位置検出器1 に含まれるシンチレータユニット 10のうち第1列のシンチレータユニット10の×z断面図である。 【 図 4 】 第 1 実 施 形 態 に 係 る 3 次 元 放 射 線 位 置 検 出 器 1 に 含 ま れ る シ ン チ レ ー タ ユ ニ ッ ト 10のうち第1層のシンチレータアレイ11の×y断面図である。 【図5】第1実施形態に係る3次元放射線位置検出器1に含まれるシンチレータユニット 10のうち第2層のシンチレータアレイ12のxy断面図である。 【図 6 】 第 1 実 施 形 態 に 係 る 3 次 元 放 射 線 位 置 検 出 器 1 に 含 ま れ る シ ン チ レ ー タ ユ ニ ッ ト 10のうち第3層のシンチレータアレイ13の×v断面図である。 【図7】第1実施形態に係る3次元放射線位置検出器1に含まれるシンチレータユニット 10 10のうち第4層のシンチレータアレイ14のxy断面図である。 【図8】第1実施形態に係る3次元放射線位置検出器1の受光素子20の光入射面へのシ ンチレーション光入射の重心位置の説明図である。 【図9】第1実施形態に係る3次元放射線位置検出器1の受光素子20の光入射面へ入射 する光の波高分布を示す図である。 【図10】実施例の3次元放射線位置検出器の受光素子の光入射面へのシンチレーション 光入射の強度分布を示す図である。 【図11】実施例の3次元放射線位置検出器の受光素子の光入射面へ入射する光の波高分 布を示す図である。 【 図 1 2 】比較例の3次元放射線位置検出器の受光素子の光入射面へのシンチレーション 20 光入射の強度分布を示す図である。 【図13】第2 実施形態に係る3次元放射線位置検出器に含まれるシンチレータユニット 10のうち第1行のシンチレータユニット10のyz断面図である。 【図14】第2 実施形態に係る3次元放射線位置検出器に含まれるシンチレータユニット 10のうち第1列のシンチレータユニット10の×z断面図である。 【図15】第2 実施形態に係る3次元放射線位置検出器に含まれるシンチレータユニット 10のうち第1層のシンチレータアレイ11のxy断面図である。 【 図 1 6 】 第 2 実 施 形 態 に 係 る 3 次 元 放 射 線 位 置 検 出 器 に 含 ま れ る シ ン チ レ ー タ ユ ニ ッ ト 10のうち第2層のシンチレータアレイ12のxy断面図である。 【図 1 7 】 第 2 実施形態に係る 3 次元放射線位置検出器に含まれるシンチレータユニット 30 10のうち第3層のシンチレータアレイ13のxy断面図である。 【図18】第2 実施形態に係る3次元放射線位置検出器に含まれるシンチレータユニット 10のうち第4層のシンチレータアレイ14のxy断面図である。 【 図 1 9 】 第 2 実 施 形 態 に 係 る 3 次 元 放 射 線 位 置 検 出 器 に 含 ま れ る シ ン チ レ ー タ ユ ニ ッ ト 10のうち第5層のシンチレータアレイ15のxy断面図である。 【図20】第2実施形態に係る3次元放射線位置検出器に含まれるシンチレータユニット 10のうち第6層のシンチレータアレイ16の×y断面図である。 【図21】第2実施形態に係る3次元放射線位置検出器の受光素子20の光入射面へのシ ンチレーション光入射の重心位置の説明図である。

【符号の説明】

40

1…3次元放射線位置検出器、10…シンチレータユニット、11~14…シンチレータ アレイ、C…シンチレータセル、R…反射材、T…透過材、20…受光素子、21…出力 端子、30…演算部、31…比演算回路、32…和演算回路、33…信号処理回路。

(13)







【図3】







【図6】





【図7】

【図8】





【図9】

【図10】





【図11】



【図12】

ali i Maria	* *			. A. 1 - A.	, 4, 2	
94. us 1 - 4	14 ¥ 15 P	3 X 8 K	b ar (<i>≸.</i> ≶ 4	હત. ડ્રે. ગય ફ્રે	4	
srakt Æsst	5 46 20 40,	16.4≓ ¢6.46	`n≤ 10+5 ₩ 42	14. Ø	ی پنج	(0
ا خە ئىتر	i€ # ∋ %	55. 04 书书	₩ × 16 36a,	ing state An ing	*. 5 * ¥	e
nga cata Sign da	की स भाषे ,	94 94 1 1 1 1	ંક નઈ શ્રેષ્ટ મેં	91 点 第1 编		
24. 2		» А ,	2 - 2 1 - 2	· . 		
ές. Έ	ą			17		
		N.	46	×.	Č.	
a f	ē.4	*	*	5		_
20	黯		22	淵	ike - 1	(a)
and the sector	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	44	新 石	N	st.	
		s ¹	1		2	

【図13】

【図14】





【図15】

【図16】





【図17】

【図18】





【図19】

【図20】





フロントページの続き

(74)代理人 100110582 弁理士 柴田 昌聰

(72)発明者 村山 秀雄
千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号 独立行政法人放射線医学総合研究所内
(72)発明者 稲玉 直子
千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号 独立行政法人放射線医学総合研究所内

(72)発明者 北村 圭司

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所内

- (72)発明者 山下 貴司
- 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内
- F ターム(参考) 2G088 EE02 FF04 FF07 GG13 GG16 GG18 GG20 JJ03 JJ05 KK06 KK07 KK09 KK21 KK29 KK35